

Tagungsbeiträge / Anmeldung

Die Anmeldung zur PRORA 2017 erfolgt ausschließlich über das Onlineformular auf iap-adlershof.com

Bitte reichen Sie Ihre Abstracts zu Vorträgen und Postern bis zum 25. August 2017 ein.

Sie haben die Möglichkeit, im Abstract-Book eine Anzeige zu schalten. Andere Unterstützung und Sponsoring sind gern willkommen. Sprechen Sie dazu mit unserem Organisationskomitee.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Die Buchung von Hotelzimmern ist bis zum 2.11.2017 zum Vorzugspreis möglich (siehe Tabelle).

Preise

Teilnahmekosten	Early bird bis 25.08.2017	Regulär
Regulär	150,00 €	200,00 €
Studenten	20,00 €	55,00 €

Ausstellungsfläche	100,00 €/m ²	150,00 €/m ²
--------------------	-------------------------	-------------------------

Übernachtung zum Vorzugspreis	Dorint Adlershof	airporthotel Adlershof
Einzelzimmer	90,00 € / Nacht	64,00 € / Nacht
Doppelzimmer	108,00 € / Nacht	79,00 € / Nacht
Frühstück	inklusive	13,00 € / Person

Rahmenveranstaltung

Besonders hingewiesen wird auf das Satellite-Meeting des Berlin Laboratory for X-ray Technologies (BLiX) und das anschließende Stiftertreffen an der TU Berlin am 29.11.2017.

Organisation und Korrespondenzanschrift

A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
D. Zimani (Sekt. IAP e. V.)
Tel.: (030) 63 92-65 00
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: (030) 63 92-6501
E-Mail: info@iap-adlershof.de

Veranstalter

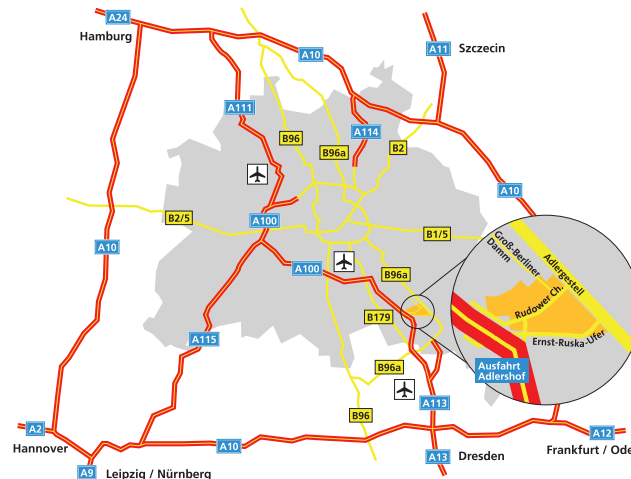
IAP Institut für angewandte Photonik e.V., Berlin
IfG – Institute for Scientific Instruments GmbH, Berlin
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
Helmut Fischer Stiftung, Stuttgart
Optec-Berlin-Brandenburg e.V.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
Arbeitskreis Prozessanalytik
SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
Technische Universität Berlin
WISTA-MANAGEMENT GMBH
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

PRORA® ist eine eingetragene Marke des IAP e.V.

Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Emmerling, BAM, Berlin
N. Esser, ISAS, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg
E. Gerndt, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
B. Kanngießer, TU Berlin
A. Kharchenko, PANalytical, Almelo, Niederlande
M. Krumrey, PTB, Berlin
F. Lerch, OpTecBB, Berlin
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
M. Ostermann, BAM, Berlin
U. Panne, BAM und HU Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative Technologies
K. Schickhoff, IAP e.V., Berlin
Th. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin
H. Stiel, MBI, Berlin
U. Waldschläger, Bruker Nano GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP e.V., Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter www.adlershof.de



Tagungsankündigung

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

30. November – 1. Dezember 2017

WISTA – Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Haus 8.05
Richard-Willstätter-Straße 11
12489 Berlin

Analytik 5.0 für Industrie 4.0

Die 9. Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik PRORA findet am 30. November und 1. Dezember 2017 statt.

Industrie 4.0 ist in aller Munde und benötigt für die Beobachtung und Steuerung der Prozesse eine moderne Analytik 5.0. Sie als Anwender, Entwickler oder Hersteller aus dem Bereich der prozessnahen Röntgenanalytik und der Kombination mit optischen Messverfahren sind eingeladen und aufgerufen, sich an der Fachtagung und Geräteausstellung PRORA zu beteiligen. Weitere Interessenten und insbesondere Studierende sind herzlich willkommen.

Bei der diesjährigen Fachtagung wird ein breites Spektrum von prozessanalytischen Verfahren behandelt, die eine Vernetzung der Sensorik mit Steuer- und Regelprozessen deutlich machen. Wichtige Anwendungen sind weiterhin die Recyclingwirtschaft zur Wiedergewinnung von knappen Wertstoffen. Prozessanalytische Verfahren zur Sicherung eines sparsamen Einsatzes von Energie und Rohstoffen in der Produktion von hochwertigen Gütern der Elektrotechnik/Elektronikindustrie, der chemischen Industrie, der Automobilindustrie und des Maschinenbaus sind ebenfalls ein herausragendes Thema.

Neben dem Erfahrungsaustausch zu bereits in der Industrie angewandten prozessnahen röntgenanalytischen Verfahren sind Neuentwicklungen aus der Forschung und den innovativen Un-

ternehmen Gegenstand der Diskussion. Dabei geht es sowohl um Methoden als auch einzelne Komponenten, Geräte und Anlagen.

Die Fachtagung wird wieder von einer Geräteausstellung begleitet. Die Aussteller erhalten Gelegenheit, ihr Produktportfolio vorzustellen. Die Präsentation erfolgt vor der Postersitzung am 30.11.17. Dazu melden Sie bitte Ihre Beiträge von maximal 5 Minuten an. Der Aufbau der Ausstellung kann bereits am 29.11.2017 ab 13.00 Uhr erfolgen.

Veranstaltungsort ist der Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof in einem neuen Rahmen bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.



Themenfelder

1 Methodische Herausforderungen

- ▶ Vergleich und Kopplung sensorgestützter Verfahren unter Nutzung des elektromagnetischen Spektrums zur Prozesskontrolle
- ▶ Neue Ansätze beim Einsatz der Röntgenanalytik unter Industriebedingungen
- ▶ Softwareentwicklung zur Auswertung der Messdaten und Spektren
- ▶ Zuverlässigkeit und Sicherheit der Daten in der Digitalisierung

2 Applikationen in der Industrie

- ▶ Prozessanalytik in der Rohstoff-(rück)-gewinnung
- ▶ Vernetzung von Objekten, Sensoren und Steuerungen im Produktionsablauf - Beispiele aus Maschinenbau, chemischer, Elektronik-, Automobilindustrie u.a.
- ▶ Kombination röntgenanalytischer und optischer Messverfahren im industriellen Einsatz
- ▶ Herausforderungen der Vor-Ort-Analyse an Messgeräte und Peripherie

3 Neue röntgenanalytische Methoden

- ▶ Röntgenmikroanalyse leichter Elemente
- ▶ Zeitaufgelöste Röntgenmessverfahren
- ▶ Röntgenmikroskopie und Absorptionsspektroskopie mit Laborgeräten
- ▶ Speziation

4 Entwicklungen bei Komponenten für prozessanalytische Geräte

- ▶ Kombinierte röntgen- und lichteoptische Bauelemente
- ▶ Weiterentwicklung von Röntgenoptiken
- ▶ Laborröntgenquellen für den Prozesseinsatz
- ▶ Detektionssysteme für den prozessnahen Einsatz